

OBIETTIVI E CONTENUTI DEL CONVEGNO

Nell'ultimo decennio le tecniche multispettrali hanno ricevuto notevole attenzione da parte del mondo scientifico. I potenziali ambiti di applicazione vanno ampliandosi e, di pari passo, si stanno diffondendo i relativi sistemi strumentali, anche se, spesso, ancora a livello di prototipo.

Tra i campi in cui la caratterizzazione spettrale e colorimetrica di intere superfici, con l'ottenimento delle relative "immagini spettrali", riveste un particolare interesse vi è senza dubbio quello della conservazione dei beni culturali, anche se le applicazioni tecnologiche del multispettrale trovano sempre più ampia diffusione in vari settori (agricoltura, alimentazione, ambiente, sensoristica spaziale, solo per citarne alcuni).

L'estremo interesse suscitato dalla scorsa edizione del Convegno di Colorimetria – nel quale sono state presentate alcune significative testimonianze sui recenti avanzamenti teorici ed applicativi delle tecnologie multispettrali d'immagine nel nostro Paese – ci ha indotti a riproporre tale tematica anche quest'anno, nella convinzione che questo appuntamento possa rappresentare un utile momento di incontro e raccordo degli interessanti contributi di ricerca che stanno emergendo a livello nazionale.

Prof. Andrea Raggi
Coordinatore del Gruppo di Lavoro SIOF
"Colorimetria e Reflectoscopia"

PROGRAMMA VENERDÌ 1 OTTOBRE 2004

9:30 Registrazione dei partecipanti

10:15 Apertura dei lavori

10:30 Proposta di una stazione a camera digitale e sfera d'integrazione per la misurazione del colore

F. FERMI, C. OLEARI, R. REVERBERI – Università di Parma, Dipartimento di Fisica - Parma; INFN, Unità di Ricerca di Parma
R. HUERTAS, M. MELGOSA – Universidad de Granada (Spagna), Departamento de Óptica

11:00 Filtri ottici variabili per spettrometria multispettrale

ANGELA PIEGARI – ENEA, Gruppo Componenti Ottici - Roma
MICHELE DAMI – Galileo Avionica - Campi Bisenzio (FI)

11:30 Ricostruzione di curve di riflettanza a partire dai valori tristimolo

S. ZUFFI – ITC, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Unità Staccata di Milano
R. SCETTINI – DISCO, Università degli Studi di Milano Bicocca

12:00 Caratterizzazione di soluzioni operative per spettrofotometri di medio – basso costo

G. D'EMILIA, E. DI CARLO – Dipartimento di Energetica, Facoltà di Ingegneria di L'Aquila – Roio Poggio (AQ)

12:30 Discussione

12:45 Intervallo – colazione libera presso Mensa dell'Università (non compresa nella quota di iscrizione)

14:00 Scanner spettrofotometrico per la digitalizzazione di quadri e altre opere d'arte di superficie piana

G. ANTONIOLI, F. FERMI, C. OLEARI, R. REVERBERI – Università di Parma, Dipartimento di Fisica - Parma; INFN, Unità di Ricerca di Parma

14:30 Spettrofotometro a scansione per la caratterizzazione multispettrale e colorimetrica ad immagine di superfici dipinte

P. CARCAGNÌ, A. DELLA PATRIA, C. SANAPÒ – Istituto Nazionale di Ottica Applicata - Arnesano (Lecce)
R. FONTANA, M. GRECO, M. G. MASTROIANNI, M. MATERAZZI, E. PAMPALONI, L. PEZZATI – Istituto Nazionale di Ottica Applicata - Firenze

15:00 Sistema multispettrale ad immagine per la caratterizzazione spettroradiometrica di opere d'arte e la valutazione delle condizioni di illuminazione

N. BO – Politecnico di Torino
P. IACOMUSSI, G. ROSSI – IEN Galileo Ferraris - Torino

16:00 Discussione

16:15 Assemblea degli appartenenti al Gruppo di Lavoro in Colorimetria e Reflectoscopia per l'istituzione di un Gruppo del Colore Italiano allargato a chi si occupa di *Imaging* e di psicologia della visione a colori con gli stessi intenti del "Colour Group" inglese e di molti altri paesi.

17:00 Chiusura dei lavori

SCHEDA DI ISCRIZIONE

da inviare alla SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
entro il giorno 25 settembre 2004
e-mail: a.raggi@unich.it (preferibilmente)
fax. 085 4546411

(all'attenzione del Prof. Andrea Raggi)

AZIENDA

NOME DEL PARTECIPANTE

QUALIFICA AZIENDALE

INDIRIZZO

CAP CITTÀ

TEL.

FAX.

E-MAIL

Si acconsente al trattamento dei dati suindicati nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari della SIOF.

Data _____ Firma _____

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

- Per Partecipanti associati SIOF: 30 €
- Per Partecipanti non associati SIOF: 65 €
(comprensiva della quota annua di adesione alla SIOF*)
- Per Studenti non associati SIOF: 42 €
(comprensiva della quota annua di adesione alla SIOF*)

*dal 2004 l'adesione alla SIOF garantisce l'iscrizione automatica, senza aggravio di costi, alla EOS (European Optical Society) come "full individual member" (www.europeanopticalsociety.org)

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti o tramite assegno all'atto della registrazione al Convegno

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Prof. Andrea Raggi
Università G. d'Annunzio
Viale Pindaro, 42 - 65127 Pescara
Tel 085 4546416 Fax 085 4546411
e-mail: a.raggi@unich.it



SIOF c/o IFAC (Ist. Fisica Applicata "Nello Carrara")
Via Panciatichi 64, 50127 Firenze
e-mail: siof@ifac.cnr.it

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO:

- dalla stazione FS: in taxi oppure con gli autobus 7 o 14 (frequenza ogni 15 min.; tempo stimato di percorrenza: circa 20 min.);
- in auto: all'uscita di Parma della A1 tenere la destra e imboccare la tangenziale di destra fino alla rotonda che incrocia con la strada per Langhirano. In questa stessa rotonda c'è l'ingresso al Campus Universitario.



KONICA MINOLTA


SIOF
Società Italiana
di Ottica e Fotonica
Italian Branch of the *European Optical Society*

COLORIMETRIA VII

TECNOLOGIE MULTISPETTRALI: ASPETTI TEORICI ED APPLICATIVI – PARTE 2

Convegno del Gruppo di Lavoro in
Colorimetria e Reflectoscopia
della Società Italiana di Ottica e Fotonica



Parma - Venerdì 1 ottobre 2004



Università degli Studi di Parma

Centro Congressi S. Elisabetta
Parco Area delle Scienze 93/A, 43100 Parma